



TRANSFER- UNDGRÜNDERZENTRUM

Röntgendiffraktometer

Das Stresstech Xstress G2R ermöglicht den Nutzenden Eigenspannungen im oberflächennahen Bereich zu messen

Einarbeitungszeit zur Selbstständigen Bedienung, ohne Vorkenntnisse: ca. 16 h

Steckbrief

Das Stresstech Xstress G2R ist ein Röntgendiffraktometer zur halbautomatischen Erstellung von Oberflächeneigenspannungsprofilen.

MOS Detektor Auflösung

2 -Bereich

Röntgenröhre

Kollimator

Messentfernung

0,03° - 0,06°/ pixel 2 -winkel

Stufenlos verstellbar zwischen +100° und 165°

Maximaler Ausgang: 30 kV bei 10 mA = 300 Watt

Austauschbar, Punktgröße: 1,2,3,4 und 5 mm

Varibel zwischen 50, 75 und 100 mm

Software

- Windows basiert (auf Rechner vor Ort installiert)
- d-sin² Messmodus
- - Messmodus
- Materialbibliothek inkludiert
- Diverse Analysmodi inkludiert